

HUBUNGAN ANTARA *FAMILY EMBEDDEDNESS* DENGAN INTENSI *TURNOVER* PADA KARYAWAN GENERASI Y

Ruth Elisa Kusumastuti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *Family Embeddedness* dengan Intensi *Turnover* pada karyawan Generasi Y. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara *Family Embeddedness* dengan Intensi *Turnover* pada karyawan Generasi Y. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 155 orang dengan 65 orang laki-laki dan 90 orang perempuan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah skala *Family Embeddedness* yang dikembangkan oleh Ramesh dan Gelfand (2010) dan skala Intensi *Turnover* yang dimodifikasi oleh Mobley, Horner, & Hollingsworth (1978) dengan menggunakan penskalaan *Likert*. Skala *Family Embeddedness* memiliki keofisien reliabilitas alpha sebesar 0,851 dan skala Intensi *Turnover* memperoleh *Alpha Cronbach* sebesar 0,911. Kedua skala ini telah diterjemahkan dan divalidasi menggunakan *professional judgement*. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah korelasi dengan program SPSS for windows versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif ($r=-0,554$) dan signifikan antara antara *Family Embeddedness* ($p=0,000$) dengan Intensi *Turnover* ($p=0,000$) pada karyawan Generasi Y. Hal ini berarti semakin tinggi *Family Embeddedness* maka semakin rendah Intensi *Turnover*.

Kata kunci: *Family Embeddedness*, Intensi *Turnover*, Generasi Y

**THE CORRELATION BETWEEN FAMILY EMBEDDEDNESS AND
TURNOVER INTENTION TO THE Y GENERATION EMPLOYEES**

Ruth Elisa Kusumastuti

ABSTRACT

This research is aimed to know the correlation between Family Embeddedness and Turnover Intention to the Y Generation employees. The hypothesis of this research is that there was negative and significant correlation between Family Embeddedness and Turnover Intention to the Y Generation employees. The subjects of the research were 155 people, they were 65 male and 90 female. The data gathering instruments used were Family Embeddedness scale which is proposed by Ramesh and Gelfand (2010) and Turnover Intention scale which was modified by Mobley, Horner, & Hollingsworth (1978) using Likert scale. Family Embeddedness had 0,851 alpha reliability coefficients and Turnover Intention scale was 0,911. These two scales were already translated and validated using professional judgement. The analysis technique of this research was correlation using SPSS program for windows 22 version. The result of this research showed that there was negative correlation ($r=-0,554$) and significant correlation between Family Embeddedness ($p=0,000$) and Turnover Intention ($p=0,000$) to the Y Generation employees. This result means that the higher degree of Family Embeddedness, the lower Turnover Intention for.

Keywords: Family Embeddedness, Turnover Intention, Y Generation